

Парламентское собрание Союза Беларуси и России
Постоянный Комитет Союзного государства
Оперативно-аналитический центр
при Президенте Республики Беларусь
Государственное предприятие «НИИ ТЗИ»
Полоцкий государственный университет



КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

Материалы XXII научно-практической конференции

(Полоцк, 16–19 мая 2017 г.)

Новополоцк
2017

УДК 004(470+476)(061.3)
ББК 32.81(4Бен+2)
К63

К63

Комплексная защита информации : материалы XXII науч.-практ. конф., Полоцк, 16–19 мая 2017 г. / Полоц. гос. ун-т ; отв. за вып. С. Н. Касанин. – Новополоцк : Полоц. гос. ун-т, 2017. – 282 с.
ISBN 978-985-531-564-4.

В сборнике представлены доклады ученых, специалистов, представителей государственных органов и практических работников в области обеспечения информационной безопасности Союзного государства по широкому спектру научных направлений.

Адресуется исследователям, практическим работникам и широкому кругу читателей.

Тексты тезисов докладов, вошедших в настоящий сборник, представлены в авторской редакции.

УДК 004(470+476)(061.3)
ББК 32.81(4Бен+2)

ТЕСТИРОВАНИЕ КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ ГЕНЕРАТОРОВ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Ю.С. ХАРИН,

НИИ прикладных проблем математики и информатики БГУ

Введение

Случайные и псевдослучайные последовательности, а также их генераторы являются неотъемлемыми элементами современных систем криптографической защиты информации для решения следующих основных задач [1-3]: генерация гаммы в поточных криптосистемах; генерация сеансовых и других ключей в криптосистемах; генерация «случайных значений» параметров для многих систем ЭЦП; формирование «случайных запросов» при реализации большинства существующих криптографических протоколов выработки общего секретного ключа и аутентификации.

Генерация случайной последовательности с произвольным законом распределения вероятностей сводится к генерации равномерно распределенной случайной последовательности (РРСП). РРСП – это последовательность дискретных случайных величин $x_1, x_2, \dots \in A = \{0, 1, \dots, N-1\}$ из конечного алфавита A мощности $2 \leq N < +\infty$, обладающая двумя свойствами (гипотеза H_0):

C_1) для любого числа $n \in \mathbb{N}$ и произвольных индексов $1 < t_1 < \dots < t_n$ случайные биты x_{t_1}, \dots, x_{t_n} независимы в совокупности;

C_2) для любого $t \in \mathbb{N}$ случайная величина x_t имеет равномерное на A распределение вероятностей: $P\{x_t = i\} = N^{-1}$, $i \in A$.

В настоящее время известно более сотни методов и алгоритмов генерации последовательностей, по своим свойствам приближающихся к РРСП. Еще больше разработано методов статистического тестирования последовательностей.

В статье представлены аналитический обзор современного состояния в области тестирования криптографических генераторов случайных и псевдослучайных последовательностей, а также перспективные методы тестирования на основе моделей стохастических зависимостей высокого порядка.

1. Аналитический обзор методов тестирования

Генератор РРСП – это устройство, позволяющее по запросу получить реализацию равномерно распределенной случайной последовательности $x_1, x_2, \dots, x_n \in A$ заданной длины n . В настоящее время в криптосистемах используются физические генераторы случайных последовательностей и программные генераторы псевдослучайных последовательностей (ПСП).

Физические генераторы используют случайность, **измеряемую** в некоторых физических процессах: квантовые процессы, шумовые колебания в резисторах и полупроводниковых диодах, частотные колебания осциллятора и другие. Основные требования, предъявляемые к физическим генераторам: «статистическая безопасность», стабильность вероятностных свойств генерируемой последовательности; эффективная аппаратная реализация. Главным достоинством физических генераторов является то, что выходная последовательность «лучше» удовлетворяет свойству C_1 . Однако физические генераторы имеют также ряд недостатков: в выходной последовательности могут воз-

никать зависимости и отклонения от равномерного распределения вероятностей, вызванные наличием погрешностей измерений; практическая невозможность повторного воспроизведения выходной последовательности, что не позволяет использовать физические генераторы для синхронной генерации ключевой последовательности при поточном шифровании; проверка соответствия образца заявленному описанию иногда невозможна без разрушения генератора.

Генератор ПСП – это компьютерная программа или программно-аппаратное устройство для имитации реализации РРСП. Имитируемая последовательность $\{x_t\}$ называется псевдослучайной, т. к. она **вычисляется** на компьютере по известному детерминированному (обычно рекуррентному) соотношению, и в тоже время ее статистические свойства «близки» (по определенным статистическим критериям) к свойствам РРСП. К генераторам ПСП, используемым в криптосистемах, предъявляются следующие требования: «большой период»; «статистическая безопасность»; криптографическая стойкость; эффективная программная и аппаратная реализация.

Важнейшим требованием, предъявляемым как к физическим генераторам случайных последовательностей, так и к генераторам ПСП является требование «статистической безопасности». Оно заключается в том, что при используемой длине n генерируемых реализаций их невозможно отличить от реализаций РРСП на заданном уровне значимости $\varepsilon \in (0,1)$. Для проверки этого требования используются статистические тесты (критерии). Статистический тест – это решающее правило, позволяющее по наблюдаемой реализации $x_1, \dots, x_n \in A$ длины n (или конечной выборке таких реализаций) с заданным уровнем значимости осуществить проверку гипотезы $H_0 = \{\{x_t\} \text{ есть РРСП}\}$ против некоторой альтернативы $H_1 = \bar{H}_0 = \{\text{нарушены свойства } C_1, C_2\}$. Существуют различные типы частных альтернатив H_1 , каждый из которых порождает свой собственный статистический тест. Поэтому на практике при проверке требования «статистической безопасности» используют «батареи статистических тестов» [4-8]. Рассмотрим наиболее известные батареи тестов.

Исторически первой батареей тестов считается батарея статистических тестов, предложенная Д. Кнутом [4] и включающая в себя следующие тесты: частотный тест, тест серий; тест интервалов; покер-тест; тест собирателя купонов; тест перестановок; тест на монотонность; тест подпоследовательностей; тест «наибольшее из t ». Большинство этих тестов являются частными случаями универсального алгоритма тестирования [3].

Батареей тестов, предъявляющей «более жесткие требования», чем батарея тестов Д. Кнута, является «DIEHARD»-батарея [5], которая предложена Дж. Марсалли в 1985 г. и содержит 16 тестов, приведенных в [3].

Третья батарея тестов предложена NIST [6] и включает следующие тесты: частотный тест; частотный тест внутри блока; тест серий; тест, основанный на рангах двочных матриц; спектральный тест; универсальный статистический тест Маурера; тест, основанный на алгоритме сжатия Лемпеля – Зива; тест, основанный на линейной сложности; тест на основе аппроксимации энтропии и другие.

Батарея тестов CRYPT-X разработана австралийским Институтом Безопасности Информации [7] и включает 13 разделов.

Еще одна батарея тестов, используемая в конкурсе NESSIE [8], включает следующие тесты: фильтрующий тест; корреляционный тест; тест Неймана – Пирсона; тест серий; тест на основе линейной аппроксимации; частотный тест; тест на основе парадокса дней рождений; универсальный статистический тест Маурера; покер-тест;

тест, основанный на алгоритме сжатия Лемпеля – Зива; тест, основанный на нелинейной сложности; спектральный тест и другие.

Проведенный в [3] обзор существующих статистических тестов показывает:

1) многие из существующих тестов не ориентированы на проверку главного свойства C_1 , а лишь частных случаев свойств C_1 , C_2 , т.е. частных случаев H_1 ;

2) многие из известных тестов построены «эвристически» и не фиксируют семейство альтернатив H_1 ;

3) многие тесты не имеют оценок мощности;

4) при включении нескольких тестов в батарею не удастся оптимизировать «составной» тест.

В связи с этим актуальны задачи разработки адекватных вероятностных моделей для описания отклонений H_1 от модели РПСР, построения статистических тестов для обнаружения и оценивания таких отклонений, порожденных наличием стохастических зависимостей высокого порядка в выходной последовательности $\{x_t\}$.

2. Методы тестирования s -мерной равномерности на основе энтропийных характеристик

Определим вложенное в H_1 семейство «альтернатив s -мерной неравномерности»: $H_{1(s)} = \{\{x_1, x_2, \dots\} = \{X_1, X_2, \dots\}\} \subset H_1$, где $X_1, X_2, \dots \in A^s$ – независимые одинаково распределенные s -фрагменты (слова) над алфавитом A с некоторым s -мерным дискретным распределением вероятностей $P_{i_1, \dots, i_s} = P\{x_1 = i_1, \dots, x_s = i_s\}$, $i_1, \dots, i_s \in A$, отличным от равномерного:

$$\Delta_s = \sum_{i_1, \dots, i_s \in A} \left| P_{i_1, \dots, i_s} - N^{-s} \right| > 0, \quad \sum_{i_1, \dots, i_s \in A} P_{i_1, \dots, i_s} \equiv 1.$$

При $s \rightarrow \infty$ семейство этих альтернатив имеет в пределе альтернативу $H_1 = \bar{H}_0$ общего вида. Чем меньше Δ_s , тем ближе альтернатива $H_{1(s)}$ к нулевой гипотезе H_0 .

Обозначим: $\{x_1, x_2, \dots, x_T\} = \{X_1, X_2, \dots, X_M\}$ – наблюдаемая реализация выходной последовательности длиной $T = M \cdot s$, разбитая на M непересекающихся фрагментов длины s , $I\{B\}$ – индикатор события B ,

$$\hat{P}_{i_1, \dots, i_s} = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M I\{X_m = (i_1, \dots, i_s)\}, \quad i_1, \dots, i_s \in A, \quad (1)$$

– статистическая оценка для P_{i_1, \dots, i_s} . Тогда тест обобщенного отношения правдоподобия для проверки $H_0, H_{1(s)}$ имеет вид:

$$\text{принимается} \begin{cases} H_0, & \text{если } \hat{H}_s - s \ln N > -\frac{1}{2M} G_{N^s-1}^{-1} (1-\varepsilon), \\ H_{1(s)} & \text{в противном случае,} \end{cases} \quad (2)$$

где $\hat{H}_s = - \sum_{i_1, \dots, i_s \in A} \hat{P}_{i_1, \dots, i_s} \ln \hat{P}_{i_1, \dots, i_s}$ – статистическая оценка s -мерной энтропии Шеннона, $G_K^{-1}(\cdot)$ – обратная функция распределения хи-квадрат с K степенями свободы, $\varepsilon \in (0,1)$ – заданный уровень значимости теста.

Тест (1), (2) удобно использовать для визуализации процесса принятия решений в виде так называемого [9] «энтропийного профиля (портрета)» – графика зависимости нормированного отклонения оценки s -мерной энтропии от ее математического ожидания при H_0 :

$$\alpha(s) = b_s \left(\hat{H}_s - E_{H_0} \{ \hat{H}_s \} \right), \quad s \in \{s_{\min}, s_{\min} + 1, \dots, s_{\max}\}. \quad (3)$$

Для иллюстрации на рис. 1, 2 представлены энтропийные профили генератора, описываемого нелинейной рекуррентой порядка 24 ($N = 2, \varepsilon = 0.05, T = 2^{32}/s$) и генератора BelT (СТБ 34.101.27-2011 в режиме гаммирования, $N = 2, \varepsilon = 0.05, T = 2^{29}$) соответственно.

Заметим, что для теста (1), (2) опасными оказываются искусственно сформированные «выходные последовательности», являющиеся 2^s -периодическим повторением фрагмента, состоящего из 2^s всевозможных s -цепочек; для таких последовательностей решение всегда будет в пользу H_0 . Во избежание этой «бреши» теста необходимо:

а) строить энтропийный профиль при различных значениях s ; б) оценку \hat{H}_s строить по пересекающимся s -фрагментам.

Отметим еще, что вместо энтропии Шеннона в (1)-(3) могут использоваться энтропийные функционалы Реньи и Тсаллиса [9].

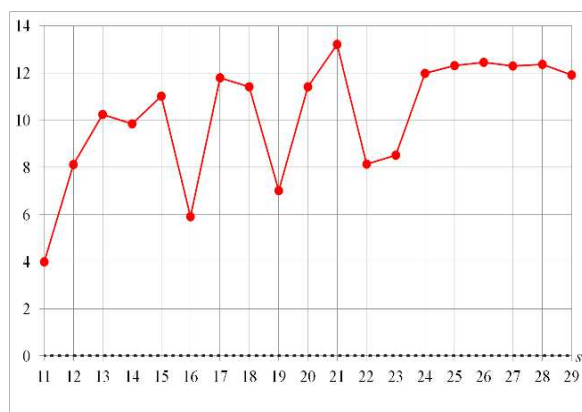


Рис. 1 – Энтропийный профиль $|\alpha(s)|$ нелинейного регистра сдвига в логарифмической шкале

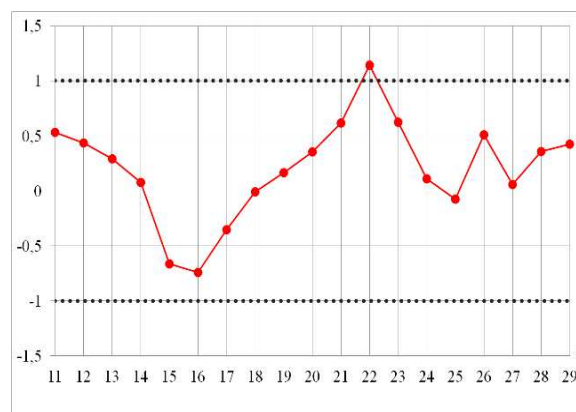


Рис. 2 – Энтропийный профиль $\alpha(s)$ генератора BelT

3. Методы тестирования на основе Марковских моделей s -го порядка

Учитывая, что универсальной (общей) моделью стохастической зависимости элементов выходной последовательности $\{x_t\}$ криптографического генератора является цепь Маркова достаточно высокого порядка s , определим вложенное в H_1

семейство альтернатив марковской зависимости: $H_1^{(s)} = \{\{x_t\} - \text{однородная цепь Маркова порядка } s \text{ с матрицей вероятностей одношаговых переходов } P\}$, где $P = (p_{i_1, \dots, i_s, i_{s+1}})$, $i_1, \dots, i_{s+1} \in A$ – $(s+1)$ -мерная матрица, $p_{i_1, \dots, i_{s+1}} = P\{x_{t+1} = i_{s+1} | x_t = i_s, \dots, x_{t-s+1} = i_1\} \neq N^{-1}$. При $s \rightarrow +\infty$ семейство этих альтернатив имеет в пределе альтернативу общего вида $H_1 = \bar{H}_0$.

Тест обобщенного отношения правдоподобия для проверки гипотез H_0 , $H_1^{(s)}$ основан на статистической оценке \hat{h}_s условной энтропии $h_s = H\{x_t / x_{t-1}, \dots, x_{t-s}\}$:

$$\text{принимается } \begin{cases} H_0, & \text{если } \hat{h}_s - \ln N > -G_f^{-1}(1-\varepsilon)/(2(T-s)), f=N^s(N-1), \\ H_1^{(s)} & \text{в противном случае.} \end{cases} \quad (4)$$

Аналогично (3) с помощью \hat{h}_s строится энтропийный профиль для $\{x_1, \dots, x_T\}$.

К сожалению, тесты (3), (4), анализирующие стохастические зависимости глубины s в выходной последовательности $\{x_t\}$, требуют экспоненциально растущей с ростом s длины анализируемой последовательности $T = O(N^{s+1})$. Для преодоления этой трудности целесообразно использовать так называемые [3] «малопараметрические модели цепей Маркова высокого порядка», т. е. модели цепей Маркова s -го порядка $(N^s \times N)$ -матрица вероятностей переходов которой зависит от «малого» числа параметров $D \ll N^s(N-1)$.

Приведем известный на сегодня перечень «малопараметрических» моделей, описание которых можно найти в [3]: модель Джекобса – Льюиса; MTD-модель Рафтери; цепь Маркова порядка s с r частичными связями (ЦМ(s, r)); цепь Маркова условного порядка.

Для иллюстрации представим разработанную в БГУ модель ЦМ(s, r) и ее применения для тестирования. Обозначим: $r \in \{1, \dots, s\}$ – параметр, называемый числом связей; $M_r = (m_1, \dots, m_r) \in M$ – произвольный целочисленный r -вектор с упорядоченными компонентами $1 = m_1 < m_2 < \dots < m_r \leq s$, называемый шаблоном связей; $Q = (q(j_1, \dots, j_{r+1}))$, $j_1, \dots, j_{r+1} \in A$, – некоторая $(r+1)$ -мерная стохастическая матрица. Матрица переходов для ЦМ(s, r) имеет следующий малопараметрический вид:

$$p_{i_1, \dots, i_s, i_{s+1}} = q(i_{m_1}, \dots, i_{m_r}, i_{s+1}), i_1, \dots, i_{s+1} \in A.$$

Это соотношение означает, что вероятность перехода в будущее состояние зависит не от всех s предыдущих состояний, а лишь от r избранных (согласно шаблону) состояний. Число параметров модели $D_{\text{ЦМ}(s,r)} = N^r(N-1) + r - 1$ может оказаться существен-

но меньше, чем для полносвязной модели ЦМ(s). Например, если $N = 2$, $s = 32$, $r = 3$, то $D_{\text{ЦМ}(s)} = 4.3 \cdot 10^9$, в то время как $D_{\text{ЦМ}(s,r)} = 10$.

В [3] построены статистические оценки для s , r , M_r , Q , а также тест для проверки гипотез H_0 , $H_1^{(s)}$ на основе модели ЦМ(s, r). Статистическую оценку \hat{Q} удобно использовать для визуализации отклонения от H_0 , когда $q(i_1, \dots, i_{r+1}) = N^{-1}$. На рис. 3, 4 представлены результаты такой визуализации для генератора со случайной обратной связью и генератора BelT СТБ 34.101.27-2011 в режиме гаммирования.

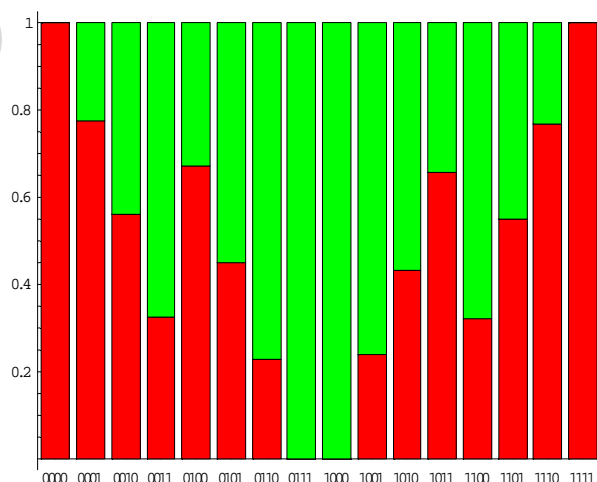


Рис. 3 – Оценка матрицы Q (черный – оценка вероятности перехода в 0, серый – в 1)

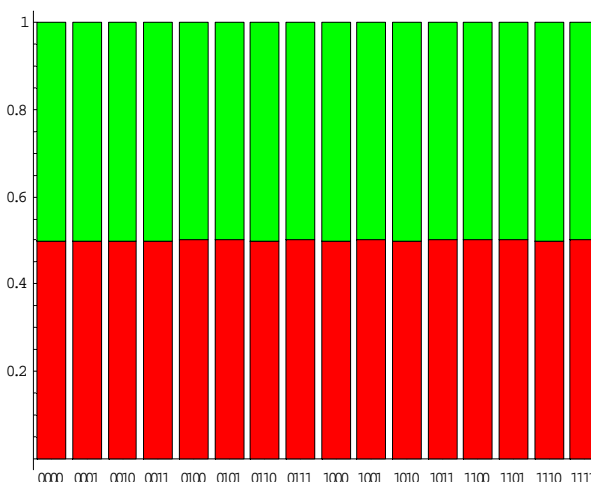


Рис. 4 – Оценка матрицы Q при $s = 32$, $r = 4$, $M_r = (1, 4, 17, 20)$

В [3, 9] приведены алгоритмы тестирования на основе других упомянутых выше малопараметрических моделей.

Список литературы

1. Алферов А.П., Зубов А.Ю., Кузьмин А.С., Черемушкин А.В. Основы криптографии. М.: Гелиос АРВ, 2001. 380 с.
2. Иванов М.А., Чугунков И.В. Теория применения и оценка качества генераторов псевдо-случайных последовательностей. М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2003.
3. Харин Ю.С., Агиевич С.В., Васильев Д.В., Матвеев Г.В. Криптология. Мн: БГУ, 2013. 512 с.
4. Кнут Д. Искусство программирования. В 3 т. М.: Мир, 1977.
5. Marsaglia G. DIEHARD: a battery of tests of randomness. URL: <http://stat.fsu.edu/~geo/diehard.html>.
6. Rukhin A. et al. A statistical test suite for random and pseudorandom number generators for cryptographic applications. NIST, 2001. URL: <http://csrc.nist.gov/rng/SP800-22b.pdf>.
7. Information Security Institute. Crypt-X, 1998. URL: www.isi.qut.edu.au.
8. List of General NESSIE Test Tools. URL: www.cryptonessie.org.
9. Харин Ю.С. Статистические оценки энтропии Реньи и Тсаллиса и их использование для проверки гипотез о «чистой случайности» / Ю.С. Харин, В.Ю. Палуха // Весці НАН Беларусі. Серыя фіз.-мат. навук. 2016. № 2. С. 37–47.